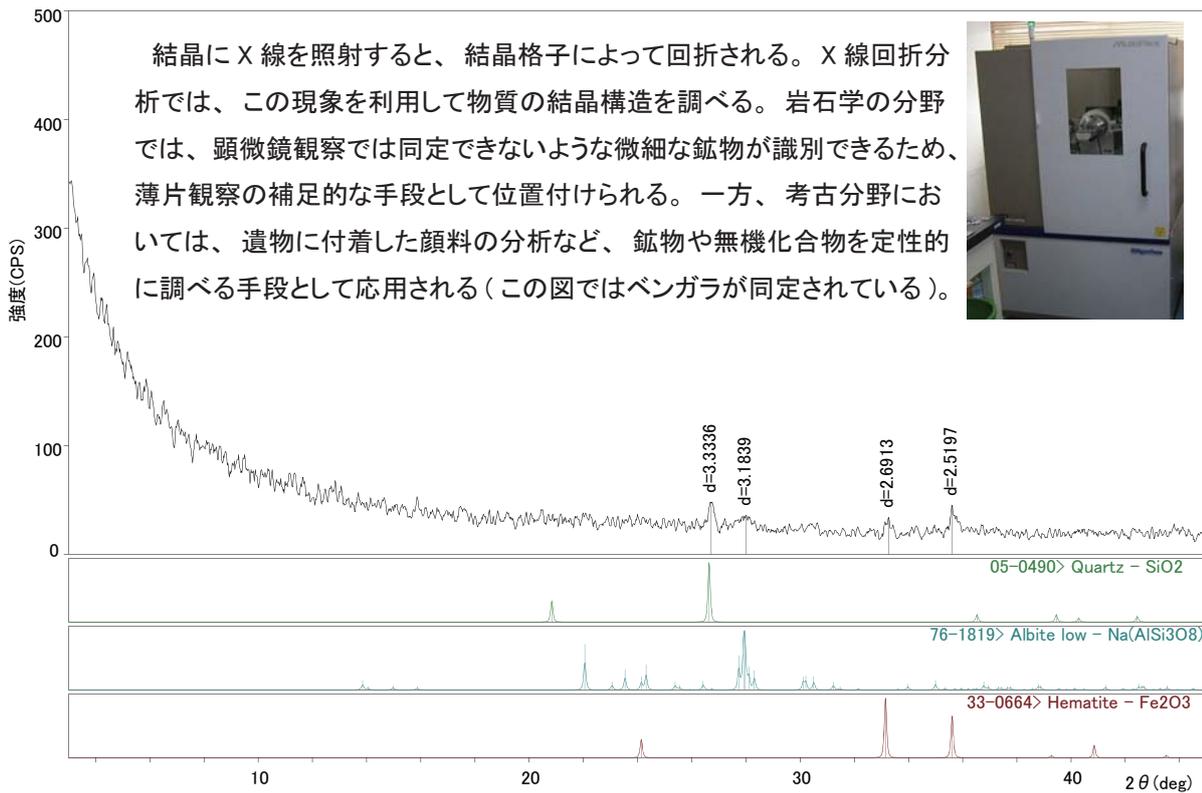


X線回折分析

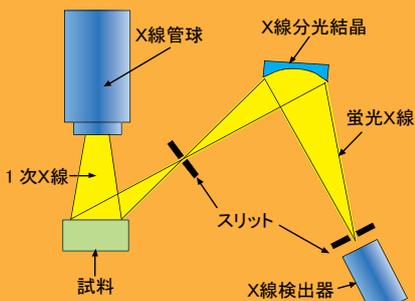


蛍光X線分析

蛍光X線分析装置は、地質分野では岩石の成分分析に用いられる。地質分野における全岩化学分析値の利用用途は広く、一般的な岩石のほか、変質岩や、未固結堆積物などの分析も行われる。一方考古学分野では、黒曜石の微量成分分析による産地推定をはじめ、土器胎土分析、遺物に付着した不明物質の検証などに用いられる。

原理

試料にX線を照射すると、その試料を構成する各元素に特有な特性X線が発生する。これが蛍光X線で、分光結晶を介した波長を検出することにより、元素の含有量が得られる。



ガラスビード作成



粉末プレス作成



蛍光X線分析装置

主成分 SiO₂, TiO₂, Al₂O₃,
T-Fe₂O₃, MnO, MgO, CaO,
Na₂O, K₂O, P₂O₅,
微量成分 Rb, Sr, Cr 等の測定。